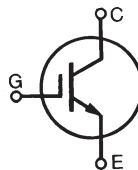


High Voltage IGBT

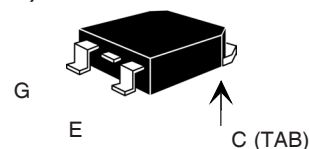
IXGH 32N170A
IXGT 32N170A

$V_{CES} = 1700 \text{ V}$
 $I_{C25} = 32 \text{ A}$
 $V_{CE(sat)} = 5.0 \text{ V}$
 $t_{fi(typ)} = 50 \text{ ns}$

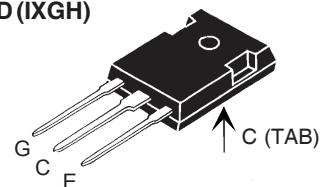


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1700	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GE} = 1 \text{ M}\Omega$	1700	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	32	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	21	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}, 1 \text{ ms}$	110	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15 \text{ V}, T_{VJ} = 125^\circ\text{C}, R_G = 5\Omega$ Clamped inductive load	$I_{CM} = 70$ @ $0.8 V_{CES}$	A
t_{SC}	$T_J = 125^\circ\text{C}, V_{CE} = 1200 \text{ V}; V_{GE} = 15 \text{ V}, R_G = 10\Omega$	10	μs
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	350	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (M3) (TO-247)	1.13/10Nm/lb.in.	
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$
Weight		TO-247 TO-268	6 4 g

TO-268 (IXGT)



TO-247 AD (IXGH)



G = Gate, C = Collector,
E = Emitter, TAB = Collector

Features

- International standard packages JEDEC TO-268 and JEDEC TO-247 AD
- High current handling capability
- MOS Gate turn-on - drive simplicity
- Rugged NPT structure
- Molding epoxies meet UL 94 V-0 flammability classification

Applications

- Capacitor discharge & pulser circuits
- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switched-mode and resonant-mode power supplies

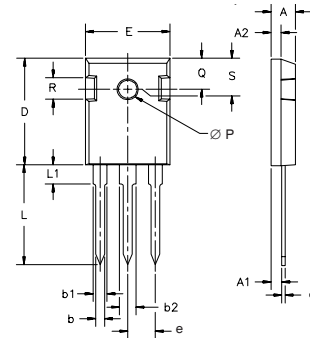
Advantages

- High power density
- Suitable for surface mounting
- Easy to mount with 1 screw, (isolated mounting screw hole)

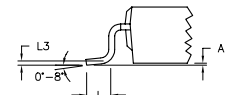
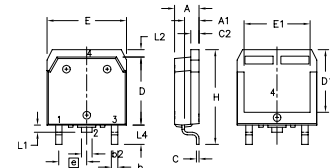
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
BV_{CES}	$I_C = 250 \mu\text{A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	1700		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250 \mu\text{A}, V_{CE} = V_{GE}$	3.0		V
I_{CES}	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$ $V_{GE} = 0 \text{ V}$		$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$	50 μA 2 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			$\pm 100 \text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}, V_{GE} = 15 \text{ V}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$	4.0 4.8	V V

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	$I_C = I_{90}$; $V_{CE} = 10\text{ V}$ Note 2	16	26	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$		3700	pF
C_{oes}			180	pF
C_{res}			43	pF
Q_g	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		155	nC
Q_{ge}			28	nC
Q_{gc}			49	nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C25}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$ $R_G = 2.7\ \Omega$, $V_{CE} = 0.5 V_{CES}$ Note 3		46	ns
t_{ri}			57	ns
$t_{d(off)}$			260	500 ns
t_{fi}			50	100 ns
E_{off}			1.5	2.6 mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C25}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$ $R_G = 2.7\ \Omega$, $V_{CE} = 0.5 V_{CES}$ Note 3		48	ns
t_{ri}			59	ns
E_{on}			4.0	mJ
$t_{d(off)}$			300	ns
t_{fi}			70	ns
E_{off}		2.4	mJ	
R_{thJC}	(TO-247)			0.35 K/W
R_{thCK}			0.25	K/W

- Notes: 1. Device must be heatsunk for high temperature leakage current measurements to avoid thermal runaway.
2. Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$
3. Switching times may increase for V_{CE} (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_J or increased R_G .

TO-247 AD Outline


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L ₁		4.50		.177
∅P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	.242	BSC

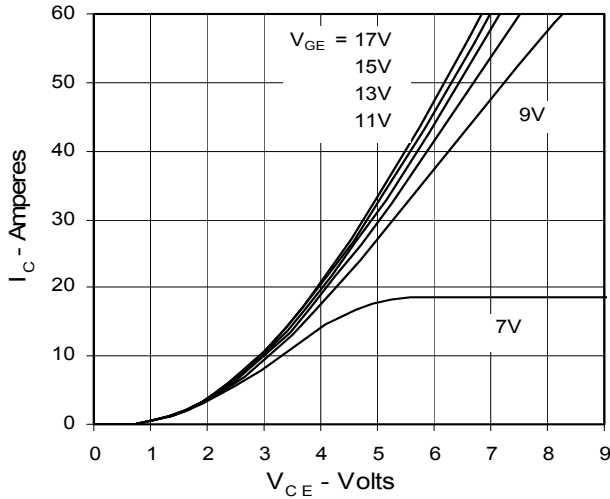
TO-268 Outline


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.9	5.1	.193	.201
A ₁	2.7	2.9	.106	.114
A ₂	.02	.25	.001	.010
b	1.15	1.45	.045	.057
b ₂	1.9	2.1	.75	.83
C	.4	.65	.016	.026
D	13.80	14.00	.543	.551
E	15.85	16.05	.624	.632
E ₁	13.3	13.6	.524	.535
e	5.45	BSC	.215	BSC
H	18.70	19.10	.736	.752
L	2.40	2.70	.094	.106
L ₁	1.20	1.40	.047	.055
L ₂	1.00	1.15	.039	.045
L ₃		0.25		.010
L ₄	3.80	4.10	.150	.161

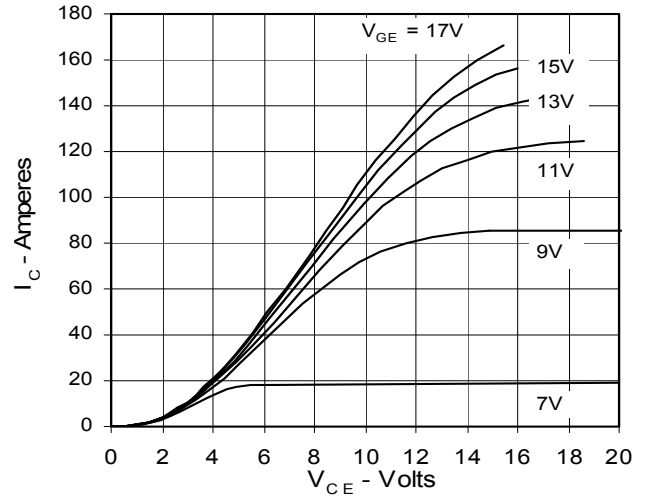
IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065B1	6,683,344	6,727,585
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123B1	6,534,343	6,710,405B2	6,759,692
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	

**Fig. 1. Output Characteristics
@ 25 Deg. C**



**Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25 deg. C**



**Fig. 3. Output Characteristics
@ 125 Deg. C**

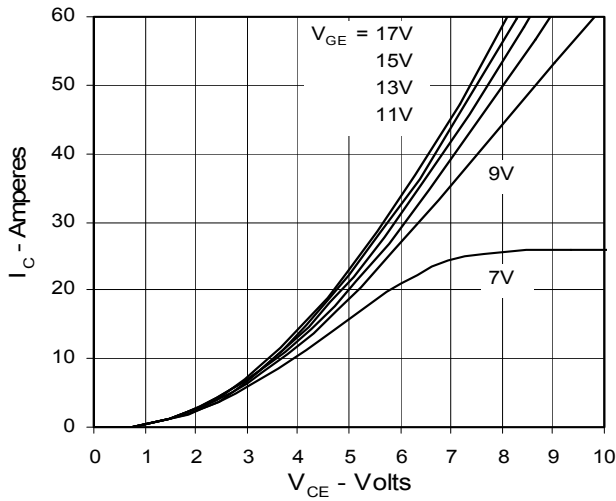
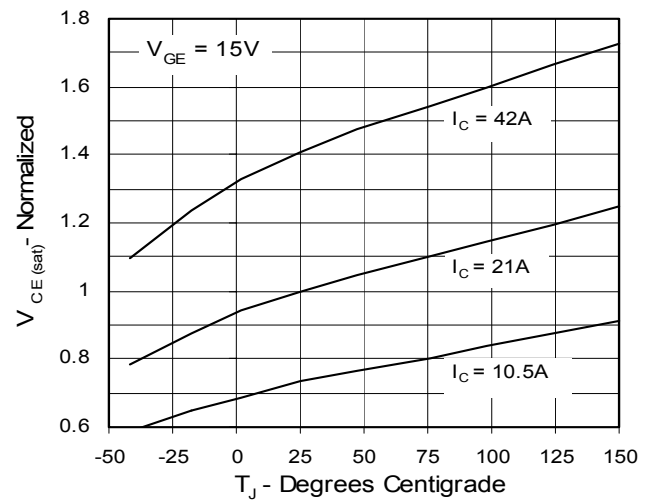


Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Temperature



**Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage
vs. Gate-to-Emitter voltage**

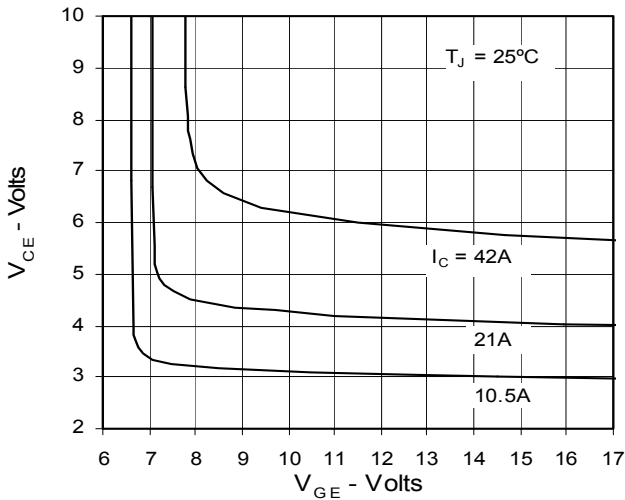


Fig. 6. Input Admittance

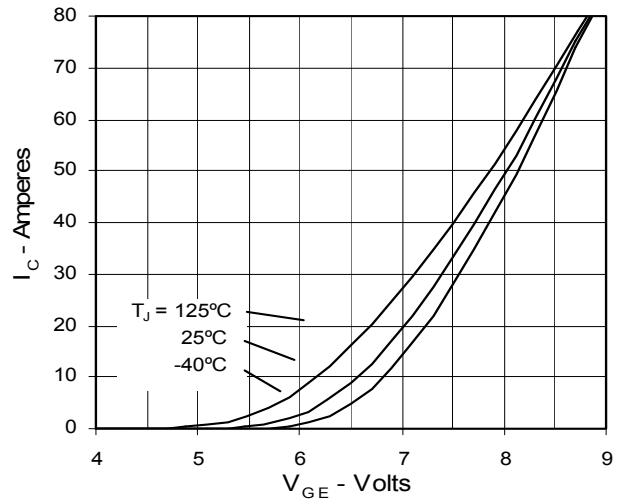


Fig. 7. Transconductance

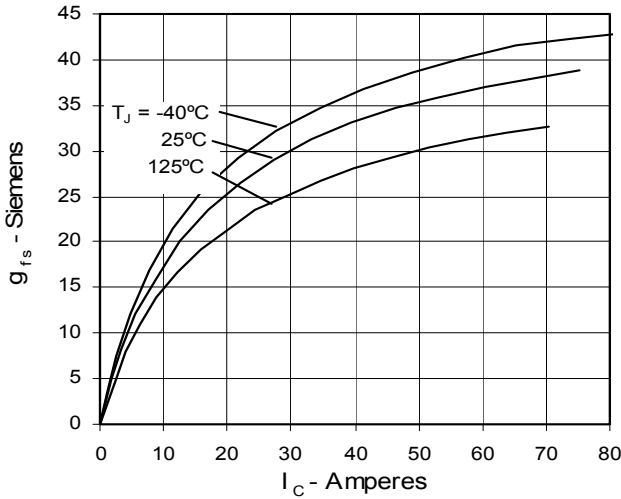


Fig. 8. Dependence of E_{off} on R_G

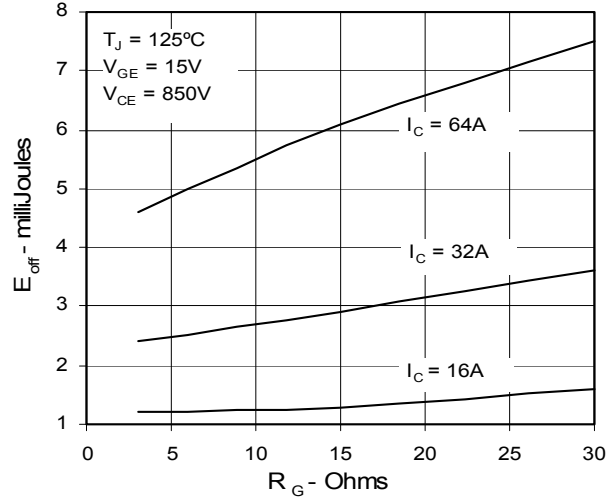


Fig. 9. Dependence of E_{off} on I_C

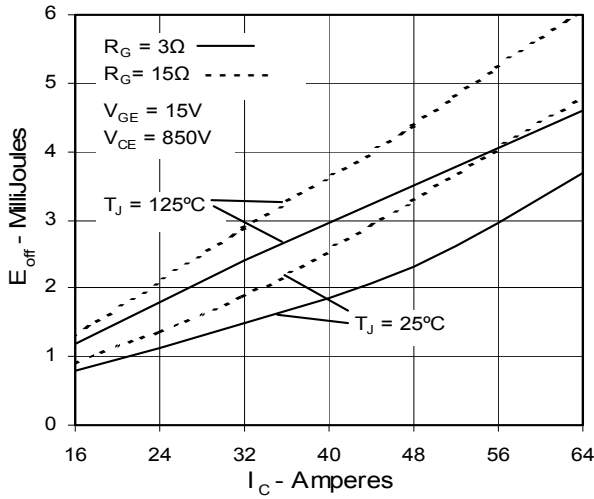


Fig. 10. Dependence of E_{off} on Temperature

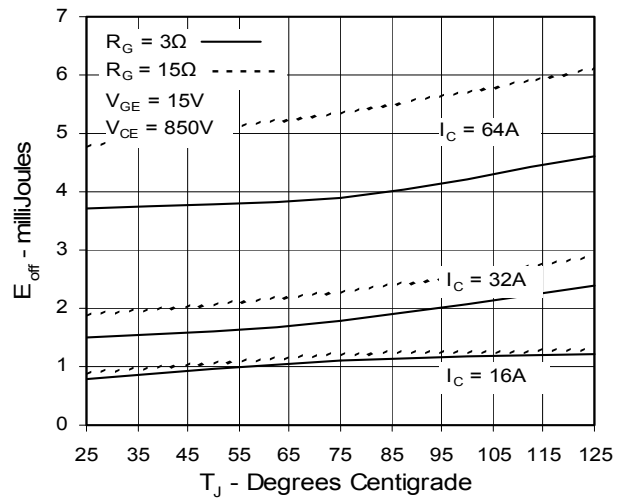


Fig. 11. Gate Charge

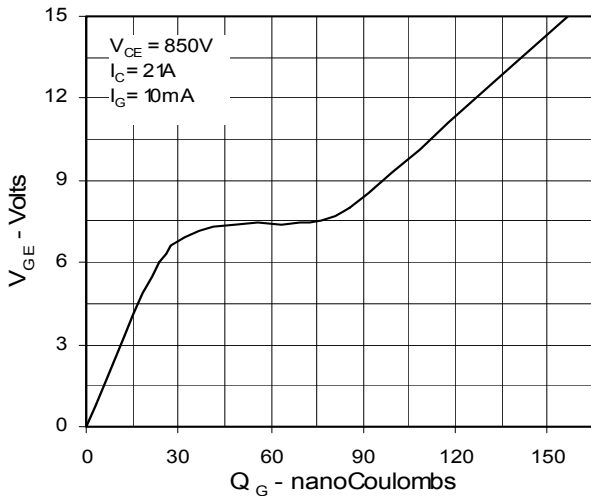
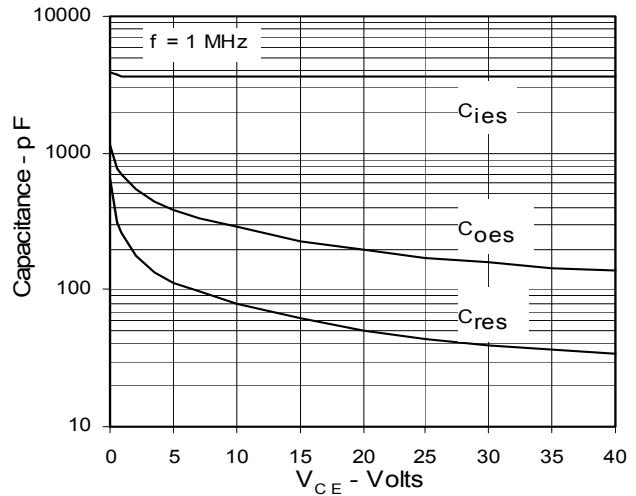


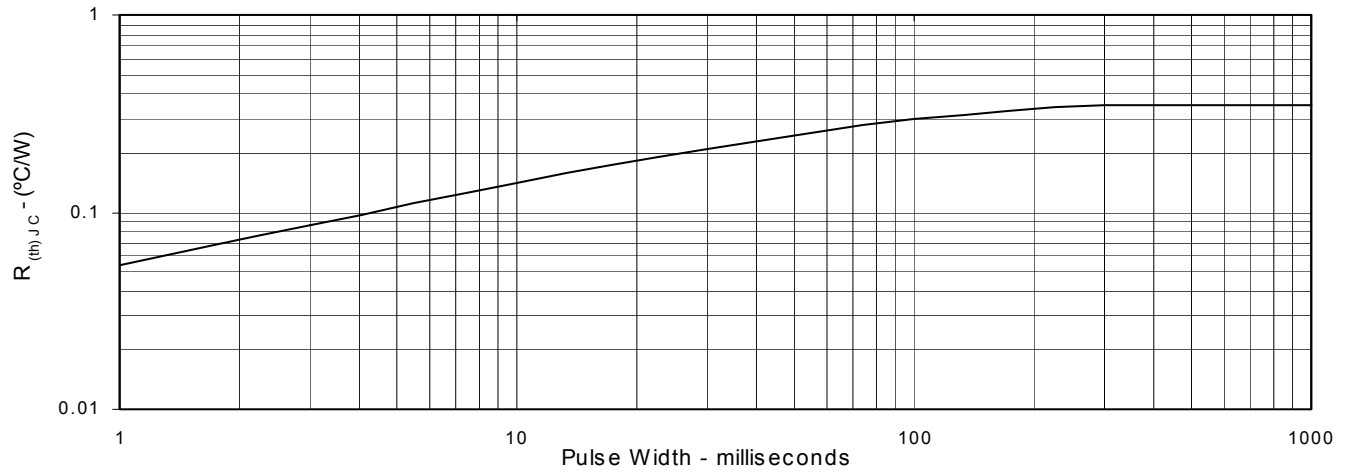
Fig. 12. Capacitance



IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065B1	6,683,344	6,727,585
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123B1	6,534,343	6,710,405B2	6,759,692
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	

Fig. 13. Maximum Transient Thermal Resistance





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331